

透過型電子顕微鏡【TEM】（日本電子：JEM-2100Plus）



【仕様・特徴】

LaB6 電子銃を搭載する汎用透過型電子顕微鏡です。加速電圧は最大 200kV まで印加可能で、バイオからマテリアルまで様々な分野での研究・開発を支援します。多彩なユーザーアシスト機能を備え、低倍率画像ステージナビゲーションを用いた視野移動や画像積算によるドリフト補正で容易に明瞭な像を取得することができます。

顕微鏡（TEM）像の他に回折図形や STEM（BF/DF）像を観察することができ、100mm² 大口径 EDS 検出器による高速組成分析が可能です。更に TEM/STEM トモグラフ（3次元再構成像取得）やホロコーン照射といった手法を用いての観察も可能です。

試料ホルダーは、標準 1 軸傾斜に加えて 2 軸傾斜、ベリリウム 2 軸傾斜、トモグラフ用高傾斜、加熱用 2 軸傾斜を用意しています。加熱ホルダーにおいては最高到達温度 800℃までの加熱が可能となります。

画面共有システムを導入しており、Zoom 等の TV 会議システムを利用して遠隔から機器操作状況を確認することができます。

分解能：格子像 0.14nm, 粒子像 0.23nm

観察可能倍率：[TEM] (MAG) × 2k ~ × 1.5M, (LOW MAG) × 30 ~ × 6k, (SA MAG) × 8k ~ × 800k [STEM] (MAG) × 20k ~ × 2M, (LOW MAG) × 100 ~ × 15k

加速電圧：80, 100, 120, 160, 200kV

【設置場所】

B5 棟 1A-14 機器管理者：工学）岡田 健司